First Hit

Generate Collection

L12: Entry 1 of 1

File: JPAB

Feb 2, 1999

PUB-NO: <u>JP411031921A</u>

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 11031921 A TITLE: VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR

PUBN-DATE: February 2, 1999

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TSUZUMI, SHUJI HANASHIMA, NAOYUKI YONEZAWA, MASA HIKITA, KAZUYASU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MITSUBISHI MATERIALS CORP

APPL-NO: JP09188024

APPL-DATE: July 14, 1997

INT-CL (IPC): $\underline{\text{H03}}$ $\underline{\text{B}}$ $\underline{\text{5}}/\underline{\text{30}}$

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To vary the VHF through SHF bands in a wide range and also to secure the high stability for a voltage controlled oscillator by forming a lead zilconate titanate(PZT) thin film or a piezoelectric thin film of lead titanate(PT) on a monocrystal substrate and using a piezoelectric resonator obtained by forming a conductive film on the piezoelectric thin film.

SOLUTION: A voltage controlled oscillator uses a 1-port or 2-port type surface acoustic wave resonator having a comb-line electrode consisting of a piezoelectric thin film formed on a monocrystal substrate and a conductive film formed on the piezoelectric thin film. The piezoelectric thin film consists of a PZT thin film or PT. For instance, a buffer layer(BST thin film) 52 of 0.2 μm thickness, a PZT thin film 53 of 0.8 μm thickness and Al electrodes 54 of 1500 Å thickness are formed on a sapphire(monocrystal) substrate 51 of 500 μm thickness to obtain a piezoelectric substrate 50. Then a gap W is set at 2 μm (1/2 surface acoustic wave length λ) between Al electrodes 54 (a repeller 54A, a comb-line electrode 54B).

COPYRIGHT: (C) 1999, JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-31921

(43)公開日 平成11年(1999)2月2日

(51) Int.Cl.⁶

H 0 3 B 5/30

識別記号

F

H 0 3 B 5/30

Α

警査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特願平9-188024

平成9年(1997)7月14日

(71)出願人 000006264

三菱マテリアル株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5番1号

(72)発明者 津々見 修司

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱

マテリアル株式会社総合研究所内

(72)発明者 花嶋 直之

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱

マテリアル株式会社総合研究所内

(72)発明者 米澤 政

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱

マテリアル株式会社総合研究所内

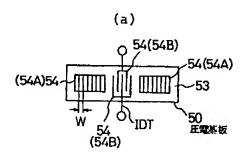
最終頁に続く

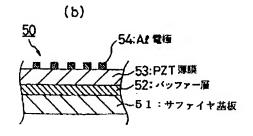
(54) 【発明の名称】 電圧制御発振器

(57)【要約】

【課題】 VHF~SHF帯域に対応し、広帯域可変、 高安定の電圧制御発振器を提供する。

【解決手段】 単結晶基板と、該単結晶基板上に構成された圧電体薄膜と、該圧電体薄膜上に構成された導電性膜とからなる櫛形電極を設けてなる1ポートまたは2ポート型弾性表面波共振子を用いた電圧制御発振器において、上記圧電体薄膜は、チタン酸ジルコン酸鉛(PZT)薄膜又はチタン酸鉛(PT)からなる電圧制御発振器。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 単結晶基板と、該単結晶基板上に形成さ れた圧電体薄膜と、該圧電体薄膜上に形成された導電性 膜とを備える圧電共振子を用いた電圧制御発振器におい て、上記圧電体薄膜がチタン酸ジルコン酸鉛薄膜又はチ タン酸鉛薄膜であることを特徴とする電圧制御発振器。 【請求項2】 上記圧電共振子が、単結晶基板と、該単 結晶基板上に形成された圧電体薄膜と、該圧電体薄膜上 に形成された導電性膜よりなる櫛形電極とを備える弾性 表面波共振子であることを特徴とする請求項1記載の電 10 圧制御発振器。

【請求項3】 上記圧電共振子が、単結晶基板と、該単 結晶基板上に形成された圧電体薄膜と、該圧電体薄膜上 に形成された導電性膜よりなる櫛形電極とを備える1ポ ート型弾性表面波共振子であることを特徴とする請求項 1記載の電圧制御発振器。

【請求項4】 上記圧電共振子が、単結晶基板と、該単 結晶基板上に形成された圧電体薄膜と、該圧電体薄膜上 に形成された導電性膜よりなる櫛形電極とを備える 2ポ 1記載の電圧制御発振器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、圧電共振子を用い た電圧制御発振器に係り、特に、圧電共振子の圧電体薄 膜としてチタン酸ジルコン酸鉛(PZT)又はチタン酸 鉛(PbTiO3:PT)を成膜した電圧制御発振器に 関する。

[0002]

 $\triangle f/f_0 = -(1/2) \cdot (1/r) \cdot (C_0 \cdot C_L / (C_0 + C_L)^2) \cdot (\triangle C/C_L) \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$

ただし、rは共振子の容量比Co/C1, △Cはパラクタ の容量変化量である。

【0006】ここで、広い周波数帯域に亘り発振周波数 f ® を可変するには、共振-反共振周波数の幅の広い共 振子、即ち、容量比ァの小さい共振子と容量変化の大き いパラクタを使途しなければならない。

【0007】ところが、従来の発振器では、図3に示す 如く、共振子と直列にパラクタの容量Ci及び回路の負 荷容量CLが入るため、共振周波数が上昇し共振子の見 かけ上の容量比が大きくなることから、図4のようにイ 40 ンダクタンスし。(伸張し)を共振子1に直列に挿入し た回路4とし、直列容量によって共振周波数を低下さ せ、共振子の誘導性領域を広くして使用している。

【0008】しかしながら、この場合でもパラクタの容 量変化量が有限でしかも小さいために、広帯域可変のも のを実現することは困難であった。

【0009】特開昭61-135205号公報には、上 記問題を解決するために、負性抵抗を伴ったインダクテ ィブトランジスタ回路を発振回路として使用し、これに より、共振子の容量比を劣化することなく周波数可変幅※50

2 *【従来の技術】圧電性基板を使用した共振子には、水晶 振動子や弾性表面波共振子及び圧電薄膜共振子等がある が、このような圧電共振子は電気的等価回路で表すと、 いずれも図1のように表すことができる。図1におい て、Coは電極間の静電容量と端子間の浮遊容量を加算 したものであり、インダクタンスL』、キャパシタンス C1 、及び抵抗R1 の直列共振回路は共振子の共振現象 を表している。

【0003】図2は、上記共振子を用いて従来最も多く 使用されているコルピッツ型の電圧制御発振器を示す基 本構成図である。図2において、1は共振子、3は破線 より右側の発振用トランジスタTrを含む回路、C i は、パラクタ(可変容量ダイオード)2の容量、C11 ~C13はそれぞれキャパシタンス、R11~R14はそれぞ れ抵抗を示している。この発振器の等価回路は、共振子 1の側と、それ以外の回路3とに区別して考えれば、図 3のように表すことができる。 このようなコルピッツ型 発振器においては、共振子1を共振-反共振の間の周波 数で使用し、誘電性リアクタンス即ちインダクタンスし ート型弾性表面波共振子であることを特徴とする請求項 20 として働かせている。この場合、回路3側のリアクタン スは容量性となり、キャパシタンス (負荷容量) C_L で 表すことができ、発振周波数はおおむねインダクタンス LとパラクタC』または負荷容量CLとパラクタCiとの 直列共振周波数となる。

> 【0004】そこで、共振子1に直列に接続したパラク タ2に印加される逆バイアス電圧 (制御電圧) Vr を変 えることにより、Cj がVr-x に比例し発振周波数fo を下記式(1)に従って可変することができる。 [0005]

※を広くすることが提案されているが、近年の移動体通信 のデジタル化に伴い、周波数の広帯域特性のより一層の 向上が求められ、電圧制御発振器においても、更に広帯 域かつ高安定の可変周波数を持つものが求められている のが現状である。

【0010】ところで、容量比ァの小さい共振子は、式 (2)、(3)に示す関係からも明らかなように、電気 機械結合係数k² の大きい圧電体材料を用いることで実 現できると考えられる。

[0011]

容量比r=Co /C1 電気機械結合係数k゚=1/(1+r)……(3)

なお、従来、電圧制御発振器の共振子の圧電体材料につ いては、圧電体基板としてタンタル酸リチウム (LiT aO3) やニオブ酸リチウム (LiNbO3) 等を用い ることが提案されている(特開平2-104120号公 報、特開平2-12585号公報)。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来、 電圧制御発振器の共振子の圧電体材料として提案されて いるLiTaO3 やLiNbO3 は、電気機械結合係数 k² は小さいが温度特性は良好であるか、或いは、電気 機械結合係数k² は大きいが温度特性が悪いというよう に、電気機械結合係数k2 と温度特性の少なくとも一方 が劣り、両特性を共に満足するものではない。

【0013】このため、電気機械結合係数k²が大きい 圧電体材料により容量比rの小さい共振子を実現して、 要求特性を満足する広帯域可変の電圧制御発振器を提供 することが困難であった。

【0014】本発明は上記従来の問題点を解決し、従来 10 の圧電体材料に比べて電気機械結合係数 k² が大きく、 かつQ値が大きく、しかも、温度特性の良好な圧電体材 料を用いた共振子を組み込むことで、VHF〜SHF帯 域に対応し、広帯域可変、高安定の電圧制御発振器を提 供することを目的とする。

[0015]

【課題を解決するための手段】本発明の電圧制御発振器 は、単結晶基板と、該単結晶基板上に形成された圧電体 薄膜と、該圧電体薄膜上に形成された導電性膜とを備え る圧電共振子を用いた電圧制御発振器において、該圧電 20 分~1時間焼成する。 体薄膜がチタン酸ジルコン酸鉛(PZT)薄膜又はチタ ン酸鉛 (PT) 薄膜であることを特徴とする。

【0016】PZT及びPTは、電気機械結合係数k2 が大きく、かつQ値が大きく、しかも温度特性が良好で あるため、PZT薄膜又はPT薄膜を形成した圧電共振 子を用いることにより、VHF~SHF帯域に対応し、 広帯域可変、高安定の電圧制御発振器を提供することが できる。

【0017】本発明において、圧電共振子としては次の ものが挙げられる。

【○○18】 ● 単結晶基板と、該単結晶基板上に形成 された圧電体薄膜と、該圧電体薄膜上に形成された導電 性膜よりなる櫛形電極とを備える弾性表面波共振子。

- ② 単結晶基板と、該単結晶基板上に形成された圧電体 薄膜と、該圧電体薄膜上に形成された導電性膜よりなる 櫛形電極とを備える1ポート型弾性表面波共振子。
- ③ 単結晶基板と、該単結晶基板上に形成された圧電体 薄膜と、該圧電体薄膜上に形成された導電性膜よりなる 櫛形電極とを備える2ポート型弾性表面波共振子。 [0019]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の電 圧制御発振器の実施の形態を説明する。

【0020】本発明の電圧制御発振器は、圧電共振子と して単結晶基板と、この単結晶基板上に形成されたPZ T薄膜又はPT薄膜の圧電体薄膜と、この圧電体薄膜上 に形成された導電性膜とを備える圧電共振子を用いるこ と以外は従来の圧電共振子を用いた電圧制御発振器と同 様の構成とすることができ、従って、その回路にはコル ピッツ型回路を用いて、図2又は図4に示すような構成 の電圧制御発振器とすることができる。

【0021】本発明に係る圧電共振子の単結晶基板とし ては、ダイヤモンド、サファイヤ、MgO、SrTiO3 等の単結晶を用いることが出来る。

【0022】単結晶基板上の圧電体薄膜としてのPZT またはPT薄膜は、必要に応じて、その厚さを10μm 以下として成膜した薄膜を、櫛形電極間に電界をかけて 分極処理することにより形成したものである。

【0023】このような単結晶基板上に圧電体薄膜を形 成するには、ゾルゲル法を採用するのが好ましく、例え ば、次のような方法で形成することができる。

【0024】即ち、PZT薄膜の形成には、酢酸鉛等の 鉛化合物、ジルコニウムブトキシド、ジルコニウムプロ ポキシド等のジルコニウム化合物及びチタニウムイソプ ロポキシド、チタニウムブトキシド等のチタン化合物を 所定のモル比で、合計濃度が10~20重量%程度とな るように、メトキシエタノール、酢酸エステル等の溶剤 に溶解したPZT薄膜形成用組成物を基板に塗布し、1 50~400℃で乾燥し、所定の膜厚になるように、こ の塗布、乾燥を繰り返す。最後に500~800℃で1

【0025】また、PT薄膜の形成には、酢酸鉛等の鉛 化合物及びチタニウムイソプロポキシド、チタニウムブ トキシド等のチタン化合物の所定のモル比で、合計濃度 が10~20重量%程度になるように、メトキシエタノ ール、酢酸エステル等の溶剤に溶解したPT薄膜形成用 組成物を基板に塗布し、150~400℃で乾燥し、所 定の膜厚になるように、この塗布、乾燥を繰り返す、最 後に500~800℃で1分~1時間焼成する。

【0026】本発明において、圧電体薄膜としてのPZ 30 T薄膜又はPT薄膜は、高周波対応とするために膜厚1 0μm以下であることが必要とされ、好ましくは0.1 $\sim \! 10 \, \mu$ m、より好ましくは $0 \cdot 2 \! \sim \! 3 \, \mu$ mの範囲で使 用目的に応じて適宜決定される。なお、PZT薄膜又は PT薄膜の膜厚が薄過ぎると圧電効果が得られず、逆 に、厚過ぎると良好な膜質が得られない。

【0027】本発明においては、このPZT又はPT薄 膜の形成に先立ち、基板上にチタン酸バリウムストロン チウム(BST)、チタン酸ストロンチウム (STO) 又はチタン酸バリウム(BTO)等のバッファー層を形 成しても良い。このようなバッファー層を形成すること により、鉛拡散防止作用により、PZT薄膜又はPT薄 膜の鉛欠損が防止されるという効果が奏される。このバ ッファー層はゾルゲル法により形成することができ、そ の膜厚は通常の場合、0.01~2μm、特に0.01 \sim 0.2 μ mであることが好ましい。

【0028】圧電体薄膜上の導電性膜としては、A1, Cu, Ag, Au, Pt等の導電性金属膜が好適であ り、このような導電性膜はスパッタ法等で形成すること ができ、その厚さは、通常の場合1000~2000μ 50 m程度である。

[0029]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明の電圧制御発振 器の構成及び効果をより具体的に説明する。

【0030】[実施例1]図2のコルピッツ回路に共振 子1として1ポート型弾性表面波共振子を組み込んで9 〇〇MHz帯の電圧制御発振器としたものを実施例1と した。図5(a)は本実施例で用いた1ポート型弾性表 面波共振子の電極構成を示す平面図、図5(b)は同断 面の拡大図である。この1ポート型弾性表面波共振子の 圧電基板 50は、サファイヤ基板(厚さ500 μ m) 5 10 μ m) 71 上に厚さ0. 2 μ mのバッファー層(BST 1上に厚さ0. 2μmのバッファー層 (BST薄膜) 5 2、厚さ0. 8μmのPZT薄膜53及び厚さ1500 ÅのA1電極54よりなり、A1電極(反射電極54 A, 櫛形電極54B) 54の間隙Wは2μm (弾性表面 波の波長入の1/2)である。

【0031】この電圧制御発振器において、制御電圧V 』を○~5∨まで可変した場合の発振周波数の変化を図 8に示す。

【0032】なお、本実施例では、圧電体薄膜としての ニウムイソプロポキシドとを所定のモル比で合計濃度2 0重量%となるように2-メトキシエタノールに溶解し たPZT薄膜形成用溶液を用い、スピンコートにより塗 布した後400℃で乾燥し、この塗布、乾燥を所定の膜 厚になるまで繰り返し、最後に650℃で60分焼成す ることにより形成した。

【0033】また、導電性膜はスパッタ法により形成し た。

【0034】 [実施例2] 図2のコルピッツ回路に共振 子1として1ポート型弾性表面波共振子を組み込んで9 00MHz帯の電圧制御発振器としたものを実施例2と した。図6(a)は本実施例で用いた1ポート型弾性表 面波共振子の電極構成を示す平面図、図6(b)は同断 面の拡大図である。この1ポート型弾性表面波共振子の 圧電基板60は、サファイヤ基板(厚さ500μm)6 1上に厚さ0.2 μmのバッファー層 (BST薄膜) 6 2、厚さ0.85μmのPT薄膜63及び厚さ1500 ÅのA1電極64よりなり、A1電極(反射電極64 A, 櫛形電極64B) 64の間隙Wは2μm(弾性表面 波の波長 λ の1/2) である。

【0035】この電圧制御発振器において、制御電圧V r を0~5Vまで可変した場合の発振周波数の変化を図 9に示す。

【0036】なお、本実施例では、PT薄膜は、酢酸鉛 とチタニウムイソプロボキシドを所定のモル比で合計濃 度10重量%となるように2-メトキシエタノールに溶 解したPT薄膜形成用溶液を用い、スピンコートにより 塗布した後400℃で乾燥し、この塗布、乾燥を所定の 膜厚になるまで繰り返し、最後に650℃で60分焼成 することにより形成した。

6 【0037】また、導電性膜はスパッタ法により形成し た。

【0038】 [実施例3] 図2のコルピッツ回路に共振 子1として2ポート型弾性表面波共振子を組み込んで9 00MHz帯の電圧制御発振器としたものを実施例3と した。図7(a)は本実施例で用いた2ポート型弾性表 面波共振子の電極構成を示す平面図、図7(b)は同断 面の拡大図である。この2ポート型弾性表面波共振子の 圧電基板70は、単結晶ダイヤモンド基板(厚さ300 薄膜)72、厚さ0.8μmのPZT薄膜73及び厚さ 1500ÅのA1電極74よりなり、A1電極 (反射電 極74A,櫛形電極74B)54の間隙Wは2μm(弾 性表面波の波長入の1/2)である。

【0039】この電圧制御発振器において、制御電圧V r を 0~5 Vまで可変した場合の発振周波数の変化を図 10に示す。

【0040】なお、本実施例では、圧電体薄膜としての PZT薄膜は、酢酸鉛とジルコニウムブトキシドとチタ PZT薄膜は、酢酸鉛とジルコニウムブトキシドとチタ 20 ニウムイソプロポキシドとを所定のモル比で合計濃度2 ①重量%となるように2ーメトキシエタノールに溶解し たPΖT薄膜形成用溶液を用い、スピンコートにより塗 布した後400℃で乾燥し、この塗布、乾燥を所定の膜 厚になるまで繰り返し、最後に650℃で60分焼成す ることにより形成した。

> 【0041】また、導電性膜はスパッタ法により形成し た。

【0042】また、実施例においては、いずれも圧電共 振子を図2に示すコルピッツ回路に組み込んで特性を調 30 べたが、比較のため、特開昭61-135205号公報 に記載される電圧制御発振器 (A) 及び同公報において 従来例として挙げた電圧制御発振器(B)について以下 の実施例と同様にして測定した発振周波数の変化を図1 1 に示した。

【0043】以上の結果から、本発明の電圧制御発振器 は、従来の圧電基板を用いたものに比べ、非常に広帯域 な、制御感度の高いものであることが明らかである。 [0044]

【発明の効果】本発明によると、単結晶基板上に構成さ 40 れたチタン酸ジルコン酸鉛 (PZT) 又はチタン酸鉛 (PT) 薄膜と、上記圧電薄膜上に構成された導電性膜 が構成された圧電共振子を用いた電圧制御発振器は、大 きな電気機械結合係数k、優れたQ特性を有するチタン 酸ジルコン酸鉛(PZT)又はチタン酸鉛(PT)を用 いるため、効果として、非常に広帯域の周波数をカバー するS/N比の優れた電圧制御発振器が提供出来る。 【図面の簡単な説明】

【図1】 圧電共振子の電気的等価回路図である。 【図2】 コルピッツ型電圧制御発振器の基本構成図で

50 ある。

【図3】 図2の電圧制御発振器の等価回路図である。

【図4】 広帯域可変にしたコルピッツ型電圧制御発振 器の構成図である。

【図5】 図5(a)は、実施例1で用いた1ポート型 弾性表面波共振子の電極構成を示す平面図、図5(b) は、同断面の拡大図である。

【図6】 図6(a)は、実施例2で用いた1ポート型 弾性表面波共振子の電極構成を示す平面図、図6(b) は、同断面の拡大図である。

【図7】 図7(a)は、実施例3で用いた2ポート型 10 52,62,72バッファー層 弾性表面波共振子の電極構成を示す平面図、図7(b) は、同断面の拡大図である。

【図8】 実施例1の電圧制御発振器の特性を示すグラ フである。

【図9】 実施例2の電圧制御発振器の特性を示すグラ フである。

8

【図10】 実施例3の電圧制御発振器の特性を示すグ ラフである。

【図11】 比較例に係る電圧制御発振器の特性を示す グラフである。

【符号の説明】

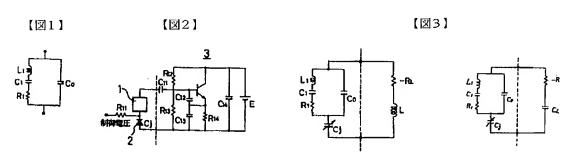
50,60,70圧電基板

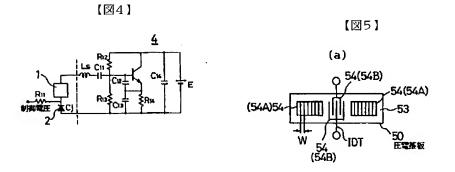
51,61,71 単結晶基板

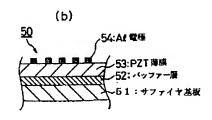
53,73 PZT薄膜

54,64,74 A1電極

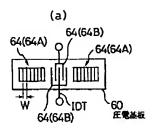
63 PT薄膜



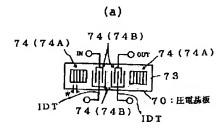


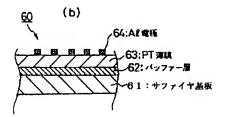


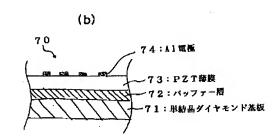


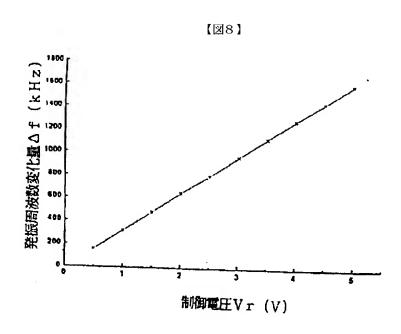


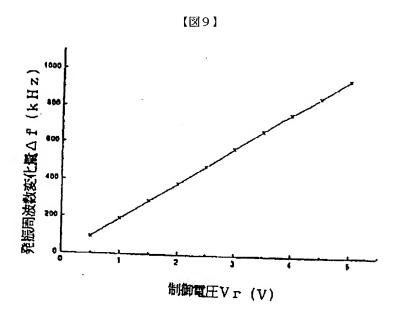
【図7】

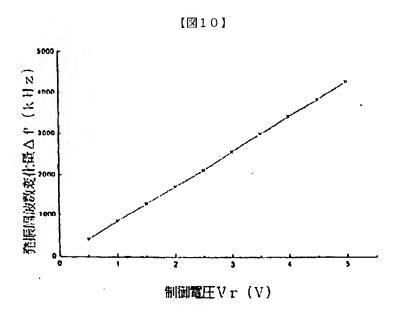




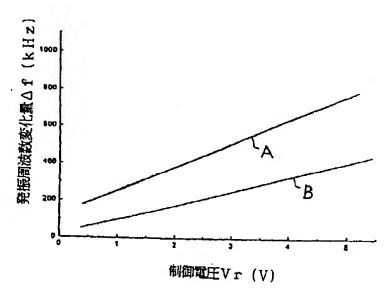












フロントページの続き

(72)発明者 疋田 和康 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 三 菱マテリアル株式会社内